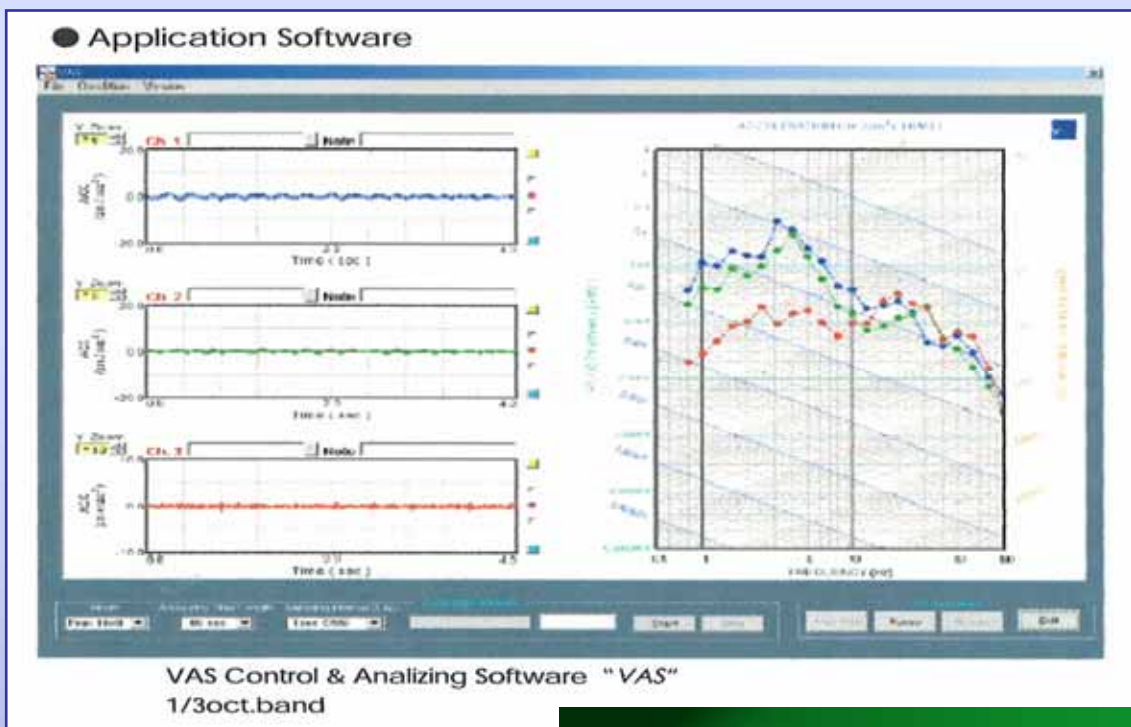


微振動計測システム VAS

半導体、液晶製造は今後益々微細化し
振動測定が重要になります



精密工場での振動調査と
コンサルティングの豊富な
経験に基づいて微振動計測
システムは開発されました



微振動計測システム VAS

概要

近年半導体の加工精度は大変高くなっており、製造工程での微振動測定も無視できない重要なファクターになっています。しかし実際に微振動を正確に測定・記録するとなると高価な測定器や分析器、データストレージなどの組み合わせが必要で、高度な専門知識を要求されました。

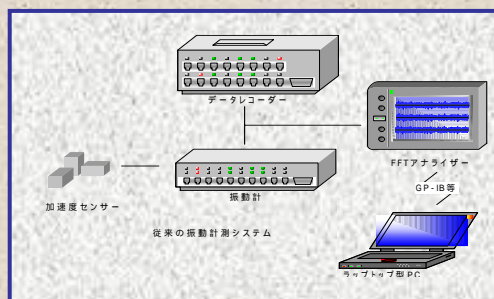
微振動計測システム VASはダイナミックレンジの広い24ビットA/Dコンバータを持ち簡単に高精度な測定が可能です。付属の専用ソフトにより、トリパタイトグラフ、1/3オクターブグラフや時歴波形出力等の測定結果は、メタファイル形式で保存し、Word・Excel・PowerPoint等で読み込み可能、テキストファイルでの出力も可能です。計測後は各種グラフでのデータ処理や解析が簡単に出来ます。

特徴・機能

- 各チャンネル独立型 型 24ビットA/Dコンバータによる幅広いダイナミックレンジ
- サーボ型加速度センサーにより、10Hz以下も高精度で測定可能
- 機器接続は現場での使用を考慮し丈夫で接続の簡単なUSBインターフェースを採用
- 測定データはリアルタイムでトリパタイトグラフや1/3オクターブグラフ等でモニター可能
- 各種使用環境を考慮しAC100-240V, DC, NI-MH充電電池の3電源に対応



VASシステム



従来の振動測定概念

VAS仕様・性能

型 式 : VAS324u-01 3チャンネル	サンプリング : 256 Hz, 0.5 ~ 2 Sec (at 200Hz)
24ビットA/Dコンバータ内蔵	512 Hz, 1 ~ 4 Sec (at 100Hz)
2次パワースフィルタ 2Vp-p/FS	計測時間 : 32 ~ 300 Sec (at 200Hz)
センサー : サーボ型加速度センサー 0.5 - 200 Hz	32 ~ 600 Sec (at 100Hz)
測定範囲 : ±0.001gal ~ ±1000gal	FFT POINT : 2048 point (Spectrum)
外形寸法 : 250W x 450D x 160H cm	8192 point (1/3 Oct.Band)
電 源 : AC100 ~ 240 V	
または単3型ニッケル水素充電電池 8本	

製造元: 株式会社 オービット
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-32-13-202

発売元: 三興通商株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-17-1 第五森ビル
Tel: 03-3503-0918 Fax: 03-3503-0920
E-Mail: sales@sankotsusho.co.jp

代理店: